Search Notes	
:	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/618,790	DIBBS, RICHARD J.	
Examiner	Art Unit	
Anthony Weier	1761	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
updated	previous search	12/15/2006	AW
			_
	17-18-		
	4		
·			
		,,,,,,	
		,	

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		-	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		<u>-</u> .	

(INCLUDING SEA	RCH STRAT	EGY)	
	DA <sup>-</sup>	re i	EXMR
·			
		•	
	1		
••			
	•		